PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 09167347 A

(43) Date of publication of application: 24.06.97

(51) Int. CI

G11B 7/00 G11B 20/18

(21) Application number: 07347986

(22) Date of filing: 15.12.95

(71) Applicant:

SONY CORP

(72) Inventor:

OKUMURA MARIKO

(54) DEVICE AND METHOD FOR OPTICAL RECORDING/REPRODUCING

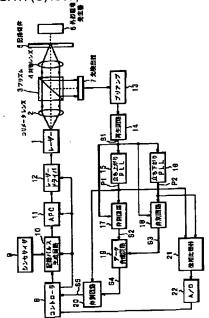
(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a device and method for optical recording/reproducing capable of simplifying the optimization of recording condition by trial write.

SOLUTION: A trial writing recording pulse signal is generated by a recording pulse generation circuit 10, and the trial write data are recorded on a trial write area of a recording medium 5 by a laser 1. A rise PLL circuit 15 and a fall PLL circuit 16 are provided, and clock signals P1, P2 synchronized respectively with the rise edge and fall edge of a regenerative binarized signal S1 from a reproducing circuit 14 are reproduced. By detecting a phase difference between the clock signals P1, P2 by a phase comparator 21, an error signal corresponding to mark length fluctuating amount Td of a recording mark by the trial write is generated. The condition correction amount of the recording corresponding to the value of the error signal is decided by a controller 8, and the recording condition is updated, and the error signal is made minimum. The

recording condition at this time is made the optimum recording condition, an regular recording is performed.

COPYRIGHT: (C)1997,JPO



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-167347

(43)公開日 平成9年(1997)6月24日

(51) Int.Cl. 6		識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
G11B	7/00		9464-5D	G11B	7/00	M	
	20/18	5 2 2	9558-5D		20/18	5 2 2 C	

審査請求 未請求 請求項の数4 FD (全 8 頁)

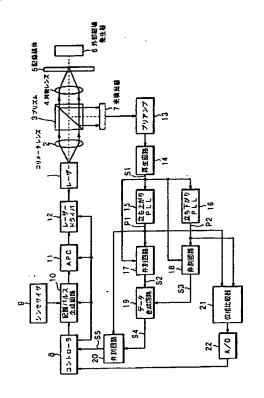
		西耳叫火	不明小 明小気の数 1 1 (主 6 員)		
(21) 出願番号	特願平7-347986	(71)出願人	000002185		
(22) 出願日	平成7年(1995)12月15日	(72)発明者	東京都品川区北品川6丁目7番35号 奥村 麻里子 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ		
		(74)代理人	一株式会社内 弁理士 杉浦 正知		

(54) 【発明の名称】 光学的記録再生装置および光学的記録再生方法

(57)【要約】

【課題】 試し書きによる記録条件の最適化を簡略化することができる光学的記録再生装置および光学的記録再生 生方法を提供する。

【解決手段】 記録パルス生成回路10により試し書き 用の記録パルス信号を生成し、レーザー1により記録媒体5の試し書き領域に試し書きデータを記録する。立ち 上がりPLL回路15および立ち下がりPLL回路16 を設け、再生回路14からの再生二値化信号S1のの 上がりエッジおよび立ち下がりエッジのそれぞれに同期 したクロック信号P1、P2を再生する。位相比較器2 1によりクロック信号P1、P2の位相差を検出することにより、試し書きによる記録マークのマーク長変動量 ては対応した誤差信号を生成する。コントローラ8により誤差信号の値に対応した記録条件の補正量を決定し記録条件の更新を行い、誤差信号を最小となるようする。このときの記録条件を最適な記録条件として正規の記録を行う。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 試し魯き領域を有する記録媒体上にディ ジタルデータを記録するようにした光学的記録再生装置 において、

上記試し書き領域に記録する記録パルス信号を生成する 手段と、

上記記録パルス信号に対応した記録マークを上記試し書 き領域に記録する手段と、

上記記録マークを再生して再生パルス信号を生成する手

上記再生パルス信号の立ち上がりエッジに同期した第1 のクロック信号を再生する第1のクロック再生手段と、 上記再生パルス信号の立ち下がりエッジに同期した第2 のクロック信号を再生する第2のクロック再生手段と、 上記第1のクロック信号および上記第2のクロック信号 の位相差を検出する手段と、

上記位相差が所定の値になるように上記記録パルスの位 相および/または振幅を制御する記録制御手段とを有す ることを特徴とする光学的記録再生装置。

【請求項2】 請求項1記載の光学的記録再生装置にお 20 いて、

上記記録媒体の上記試し書き領域以外の領域に記録され た上記ディジタルデータを再生するために、上記第1の クロック信号により上記再生パルス信号をラッチするこ とにより第1の信号を生成する手段と、上記第2のクロ ック信号により上記再生パルス信号をラッチすることに より第2の信号を生成する手段と、上記第1の信号の立 ち上がりおよび上記第2の信号の立ち下がりを合成する ことにより合成信号を生成する手段と、上記第1のクロ ック信号により上記合成信号をラッチすることにより再 30 生信号を生成する手段とを有することを特徴とする光学 的記録再生装置。

【請求項3】 試し書き領域を有する記録媒体上にディ ジタルデータを記録するようにした光学的記録再生方法 において、

上記試し書き領域に記録する記録パルス信号を生成する ステップと、

上記記録パルス信号に対応した記録マークを上記試し書 き領域に記録するステップと、

上記記録マークを再生して再生パルス信号を生成するス 40 テップと.

上記再生パルス信号の立ち上がりエッジに同期した第1 のクロック信号を再生するステップと、

上記再生ステップからの再生パルス信号の立ち下がりエ ッジに同期した第2のクロック信号を再生するステップ

上記第1のクロック信号および上記第2のクロック信号 の位相差を検出するステップと、

上記位相差が所定の値になるように上記記録パルスの位 相および/または振幅を制御する記録制御ステップとを 50 および光学的記録再生方法を提供することにある。

有することを特徴とする光学的記録再生方法。

【請求項4】 請求項3記載の光学的記録再生方法にお いて、

上記記録媒体の上記試し書き領域以外の領域に記録され た上記ディジタルデータを再生するために、上記第1の クロック信号により上記再生パルス信号をラッチするこ とにより第1の信号を生成するステップと、上記第2の クロック信号により上記再生パルス信号をラッチするこ とにより第2の信号を生成するステップと、上記第1の 10 信号の立ち上がりおよび上記第2の信号の立ち下がりを 合成することにより合成信号を生成するステップと、上 記第1の信号により上記合成信号をラッチすることによ り再生信号を生成するステップとを有することを特徴と する光学的記録再生方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、光学的記録再生 装置および光学的記録再生方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、光磁気 (MO) ディスクなどのよ うに、記録媒体にレーザー光を照射し熱的に記録マーク を記録する光学的記録再生装置が知られている。このよ うな従来の光学的記録再生装置においては、記録マーク 同士の熱干渉、記録媒体の感度のバラツキ、動作環境温 度の変化などにより、記録マーク長が変動する問題があ

【0003】この対策として、あらかじめ記録媒体の試 し書き領域に二種類の試し書きパターンを用いて試し書 きを行い、これらの試し書きパターンから得られる再生 信号からそれぞれの試し書きパターンの中心レベルを検 出し、その差が0になる最適記録パワーを見つけ出し、 その最適記録パワーに基づいて正規の情報記録を開始す るにあたって、試し書きデータならびに正規情報の入力 データビット列の記録マークに応じた記録パルス列と記 録補助パルス列とを発生させ、レーザー光源を駆動して これらのパルスに対する光強度またはエネルギーレベル を制御するものがある(例えば特開平6-36377号 公報参照)。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述の 従来技術は、試し書きによる記録条件の最適化は記録バ ワーの制御のみにより行われ、また、記録補償の最適な 振幅レベルなどの検出は、ディスク毎またはトラック毎 にそれぞれ値を振ってジッター評価により行うため、非 常に手間と時間のかかるという問題があった。また、試 し書きパターン中心レベルを検出するために専用の回路 を設ける必要があり装置構成が複雑となる。

【0005】したがって、この発明の目的は、記録条件 の最適化を簡略化することができる光学的記録再生装置

[0006]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、請求項1に記載の発明は、試し書き領域を有する記録媒体上にディジタルデータを記録するようにした光学的記録再生装置において、試し書き領域に記録する記録パルス信号を生成する手段と、記録パルス信号を生成する手段と、記録マークを試し書き領域に記録する手段と、記録マークを再生して再生パルス信号を生成する手段と、再生パルス信号の立ち上がりエッジに同期した第1のクロック信号を再生する第1のクロック再生手段と、再生パルス信号の立ち下がりエッジに同期した第2のクロック信号を再生する第2のクロック再生手段と、第1のクロック信号および第2のクロック信号の位相差を検出する手段と、位相差が所定の値になるように記録パルスの位相および/または振幅を制御する記録制御手段とを有することを特徴とするものである。

【0007】請求項3に記載の発明は、試し書き領域を有する記録媒体上にディジタルデータを記録するようにした光学的記録再生方法において、試し書き領域に記録する記録パルス信号を生成するステップと、記録ペークを試し書き領域に記録するステップと、記録マークを試し書き領域に記録するステップと、記録マークを試し書き領域に記録するステップと、記録マークを再生して再生パルス信号を生成するステップと、再生パルス信号の立ち上がりエッジに同期した第1のクロック信号を再生するステップと、再生ステップからの再生パルス信号の立ち下がりエッジに同期した第2のクロック信号を再生するステップと、第1のクロック信号および第2のクロック信号の位相差を検出するステップと、位相差が所定の値になるように記録パルスの位相および/または振幅を制御する記録制御ステップとを有することを特徴とする。30

【0008】上述したこの発明による光学的記録再生装置によれば、記録媒体の試し書き領域に記録された記録マークからの再生パルス信号の立ち上がりに同期した第1のクロック信号と、立ち下がりに同期した第2のクロック信号との位相差を比較し、この位相差が所定の値になるように記録パルス信号の位相および/または振幅を制御することにより記録条件の設定が行われるので、従来の技術に比べて記録条件の最適化を簡略化することができる。

[0009]

【発明の実施の形態】以下、この発明の一実施例について図面を参照しながら説明する。図1は、この発明の一実施例による光学的記録再生装置を示すブロック図である。図1に示すように、この一実施例による光学的記録再生装置においては、レーザー1、コリメータレンズ2、プリズム3および対物レンズ4により光ヘッド部が構成されている。5は、情報を記憶させるための記録媒体、6は、記録および消去時に記録媒体5に補助磁界を印加するための外部磁場発生器、7は、記録媒体5からの反射光を検出するための光検出器を示す。

【0010】記録時においては、コントローラ8には、外部からの命令や記録されるディジタルデータが供給され、コントローラ8において、これらの信号の変調が行われ変調方式に対応した記録符号列が生成される。シンセサイザ9においては、この光学的記録再生装置全体の基準クロック信号が生成される。これらのコントローラ8からの記録符号列およびシンセサイザ9からの基準クロック信号は、記録パルス生成回路10に供給される。

【0011】記録パルス生成回路10においては、記録符号列に対応した記録パルス信号が生成される。この記録パルス生成回路10からの記録パルス信号は、APC (Auto Power Control)回路11に供給される。このAPC回路11は、記録時のレーザーパワーを適切なものにするためのものであり、このAPC回路11からの出力はレーザードライバ12に供給される。レーザードライバ12においては、記録パルス信号に対応した記録電流が生成される。このレーザードライバ12からの記録電流はレーザー1に供給され、この記録電流によりレーザー1の発振が制御される。なお、記録パルス生成回路10、APC回路11およびレーザードライバ12のそれぞれには、コントローラ8からの制御信号が供給される。

【0012】レーザー1からのレーザー光は、コリメータレンズ2、プリズム3および対物レンズ4を通して記録媒体5に集束される。記録媒体5には外部磁場発生器6により所定の一方向に補助磁界が印加され、レーザー光が照射された領域に記録マークが形成される。消去時は、レーザー1を連続的に発振させ、外部磁場発生器6により記録媒体5に記録時と逆方向の補助磁界を印加することにより行われる。

【0013】図2は、この一実施例による光学的記録再生装置における記録方法を説明するための略線図である。この一実施例による光学的記録再生装置の変調方式には、例えば(1,7) RLLコードが採用される。この場合、コントローラ8において生成される記録符号列は2T~8Tの七通りとなる。ここで、Tはシンセサイザ9において生成される基準クロック信号の周期に等しい。また、この一実施例による光学的記録再生装置においては、記録時にレーザー光の光強度を変化させる光変調方式が採用される。図2は、この(1,7) RLLコードの最短マークの2Tマークおよび最長マークの8Tマークの例について示す。ここで、図2Aは、記録媒体5に記録される記録マークの形状を示し、図2Bは図2Aの記録マークに対応したレーザー発振波形を示す。

【0014】図2に示すように、レーザー発振波形は、記録符号列の長さに対応したデータ記録領域、プリヒート領域および低レベル領域の三領域を有する。データ記録領域は、記録符号列に対応した記録パルス信号により制御された記録電流に対応した所定のパルス列により構 が 成される。また、データ記録領域においては、記録媒体

5 に記録を行うために所定の振幅でレーザーを発振させている。この振幅は、記録パルス生成回路 1 0 からの記録パルス信号の振幅に対応している。

【0015】また、データ記録領域における先頭パルスの立ち上がりにはパルス長さ削り幅Twが設けられている。このパルス長さ削り幅Twを調整することにより、記録マークの立ち上がりエッジの位置の調整が行われる。また、データ記録領域における最終パルスの後には、プリヒート領域におけるレーザー発振パワーよりも低いレーザー発振パワーの低レベル領域が設けられてい 10る。Toはこの低レベル領域の長さを示す。この低レベル領域の長さToを調整することにより、記録マークの立ち下がりエッジに位置の調整が行われる。

【0016】データ記録領域におけるレーザー発振強度、パルスの長さ削り幅Twおよび低レベル領域の長さToは、記録媒体5への試し書き処理により設定される。この試し書き処理の詳細については後述する。

【0017】再生時は、レーザー1を低パワーで発振させて記録媒体5にレーザー光を入射させる。記録媒体5からの反射光は、プリズム3により光路が分離されて光 20検出器7に導入される。光検出器7の前には、検光器

(図示せず)が設けられており、光検出器7に導入される記録媒体5からの反射光はこの検光器によりp偏光およびs偏光が分離され、光検出器7によりそれぞれの偏光成分と対応する検出信号が減算されることにより再生信号が得られる。この再生信号はプリアンプ13により増幅され、再生回路14に供給される。

【0018】図3は、この一実施例による再生方法を説明するためのタイミングチャートである。図3Aおよび図3Bに示すように、記録媒体5に記録された記録マー30クに対応した再生パルス信号としての再生二値化信号S1が、再生回路14において生成される。この再生回路14からの再生二値化信号S1は、立ち上がりPLL回路15、立ち下がりPLL回路16および弁別回路17、18のそれぞれに供給される。

【0019】立ち上がりPLL回路15においては、図3Cに示すように、再生二値化信号S1の立ち上がりエッジに対応した立ち上がりエッジパルスが生成されるとともに、図3Eに示すように、この立ち上がりエッジパルスに同期した、第1のクロック信号としてのクロック信号P1が再生され、このクロック信号P1が弁別回路17に供給される。一方、立ち下がりPLL回路16においては、図3Dに示すように、再生二値化信号S1の立ち下がりエッジに対応した立ち下がりエッジパルスが生成されるとともに、図3Fに示すように、この立ち下がりエッジパルスに同期した、第2のクロック信号P2が弁別回路18に供給される。

【0020】弁別回路17、18は例えばラッチ回路に より構成される。弁別回路17においては、再生回路1 50

4からの再生二値化信号S1が、立ち上がりPLL回路 15からのクロック信号P1の立ち上がりエッジでラッチされることにより、図3Gに示すように、第1の信号 としてのラッチ信号S2が生成される。また、弁別回路 18においては、再生回路14からの再生二値化信号S 1が、立ち下がりPLL回路16からのクロック信号P 2の立ち上がりエッジでラッチされることにより、図3 Hに示すように、第2の信号としてのラッチ信号S3が 生成される。これらのラッチ信号S2、S3はデータ合 成回路19に供給される。

【0021】データ合成回路19は例えばフリップフロップ回路により構成されている。このデータ合成回路19においては、ラッチ信号S2の立ち上がりとラッチ信号S3の立ち下がりとが合成され、合成二値化信号S4が生成される。この合成二値化信号S4は弁別回路20に供給される。この弁別回路20には、図3Jに示すク信号P1の反転信号も供給される。この弁別回路20は、例えばフリップフロップ回路により構成される。この弁別回路20においては、データ合成回路19からの合成二値化信号S4が立ち上がりPLL回路15からの合成二値化信号S4が立ち上がりPLL回路15からの合成二値化信号S4が立ち上がりPLL回路15からの合成二値化信号S4が立ち上がりPLL回路15からの合成二位化信号S4が立ち上がりPLL回路15からの

【0022】通常は、記録媒体5に記録された記録マー クは、記録時に最適な記録条件で記録されるようになさ れているために正しいマーク長を有している。ところ が、図3に示した例では、記録マークが正規のマーク長 に対してT/2だけ長めに記録されている。このような 場合には、特に、再生二値化信号S1とクロック信号P 1またはクロック信号 P2との微妙なタイミングによ り、図3Gおよび図3Hに示すように、ラッチ信号S2 の立ち下がりおよびラッチ信号S3の立ち上がりがばら つき不安定になるので、ラッチ信号S2、S3の信頼性 が低下する。そこで、データ合成回路19を設け、この データ合成回路19において、ラッチ信号S2の立ち上 がりおよびラッチ信号S3の立ち下がりを合成すること により、常に安定した合成二値化信号S4を得ることが できるとともに、この合成二値化信号S4をラッチして 得られる再生信号S5も安定する。

【0023】さらに、この一実施例の光学的記録再生装置においては、試し書き処理時に、記録条件の最適化を行うために、立ち上がりPLL回路15からのクロック信号P1および立ち下がりPLL回路16からのクロック信号P2が供給される位相比較器21が設けられている。この位相比較器21においては、クロック信号P1、P2の位相差が検出され、この位相差に対応した誤差信号がA/D変換器22に供給され、A/D変換される。このA/D変換器22からのディジタル化された誤差信号はコントローラ8に供給される。

【0024】以下に、この試し書き処理について詳細に 説明する。図4はこの一実施例による光学的記録再生装 置における試し書き処理を説明すためのタイミングチャ ートである。この試し書き処理は、通常、記録媒体5の 交換に伴う記録媒体5の記録感度の変動などを検出し、 記録媒体5へ記録条件を最適化するために、記録媒体5 に正規のディジタルデータの記録を行う前に行われる。 この試し書き処理は、記録媒体5の交換毎に行われる。 【0025】この試し書き処理を行うためには、まず、 記録媒体5の最内周または最外周に設けられた試し書き 領域に、所定の記録データが記録される。このときの記 録データとしては、記録に厳しいパターンを用いること が好ましい。この例では、この記録に厳しいパターンと して、例えば、(1,7) RLLコードの最短マークで ある2 Tが採用される。コントローラ8の制御のもと に、記録パルス生成回路10において、試し書きパター ンに対応した試し書き用記録パルス信号が生成される。 このとき、この試し書き用記録パルス信号の位相(Tw およびTo) および振幅は、所定の初期条件に設定され ている。この試し書き用記録パルス信号が、APC回路 20 11を介してレーザードライバ12に供給され、レーザ ードライバ12からの試し書き用記録電流によりレーザ -1を発振させる。これにより、図4Aに示すように、 記録媒体5の試し書き領域に試し書き記録マークが記録

【0026】記録条件の最適化は、この試し書き記録マ ークを再生することにより行われる。まず、この試し書 き用記録マークの記録の後、レーザー1を低パワー発振 させて、記録媒体5の試し書き領域を再生する。これに より、図4Bに示すように、再生回路14において再生 30 二値化信号S1が生成される。この場合、試し書き用記 録マークは、正規の2Tマークに対してマーク長変動量 Tdを有している。この再生二値化信号S1は、立ち上 がりPLL回路15および立ち下がりPLL回路16に 供給される。

される。

【0027】立ち上がりPLL回路15においては、図 4 Cに示すように、再生二値化信号S1の立ち上がりエ ッジに対応した立ち上がりエッジパルスが生成されると ともに、図4Eに示すように、この立ち上がりエッジパ ルスに同期した、第1のクロック信号としてのクロック 40 信号P1が再生される。また、立ち下がりPLL回路1 6においては、図4Dに示すように、再生二値化信号S 1の立ち下がりにエッジに対応した立ち下がりエッジパ ルスが生成されるとともに、図4Fに示すように、この 立ち下がりエッジパルスに同期した、第2のクロック信 号としてのクロック信号P2が再生される。

【0028】ここで、クロック信号P1とクロック信号 P2との間の位相差は、試し書き用記録マークのマーク 長が正規の長さ(例えば2T)と一致している場合には 規の長さと一致していない場合には、マーク長の差とし て検出される。図4に示す例では、試し書き用記録マー クが正規の2Tマークに対してマーク長変動量Tdを有 しているために、クロック信号P1、P2間に、このマ ーク長変動量Tdに対応した位相差が生じている。立ち 上がりPLL回路15で再生されたクロック信号P1お よび立ち下がりPLL回路16で再生されたクロック信息 号P2は、位相比較器21に供給され、そこで両者の位

相差が誤差信号として検出される。この誤差信号は、A /D変換器22においてA/D変換され、この誤差信号 に対応した値がコントローラ8に供給される。

【0029】コントローラ8には、誤差信号に対応した 値と、これに対応する記録条件の補正量のテーブルが設 けられて。そこで、コントローラ8は、A/D変換器2 2より供給された値をこのテーブルに照らし合わせて記 録条件の補正量を決定する。そして、この補正量の情報 を、記録パルス生成回路10、APC回路11およびレ ーザードライバ12に供給して、記録パルス信号のパル ス長さ削り幅Twおよび低レベル領域の幅Toなどの記 録パルス信号の位相および/または記録パルス信号のデ ータ記録領域、プリヒート領域および低レベル領域の各 領域における振幅により決まる記録条件を更新する。こ れを、誤差信号が最小または所定の値(例えば0)にな るように繰り返し行うことにより、記録条件を最適なも のに収束させる。そして、この最適化された記録条件 で、記録媒体5の正規の記録領域に情報の記録が開始さ れる。

【0030】以上、この発明の実施形態について具体的 に説明したが、この発明は、上述の実施形態に限定され るものではなく、この発明の技術的思想に基づく各種の 変形が可能である。例えば、上述の一実施例による光学 的記録再生装置においては、記録方式として光変調方式 が採られているが、これは、磁界変調方式でもよい。

【0031】また、上述の一実施例による光学的記録再 生装置においては、記録媒体5の最内周または最外周の 試し書き領域に試し書きが行われるが、 2 C A V (2 o neConstant Angular Veloci t y) のように各ゾーンで基準クロック信号の周期が異 なりデータ転送レートが異なるような場合には、各ゾー ン毎に試し書き領域を設けて、各ゾーン毎に試し書き処 理による記録条件の最適化を行うようにしてもよい。

[0032]

【発明の効果】以上説明したように、この発明による光 学的記録再生装置によれば、記録媒体の試し書き領域に 記録された記録マークからの再生パルス信号の立ち上が りに同期した第1のクロック信号と、立ち下がりに同期 した第2のクロック信号との位相差を比較し、この位相 差が所定の値になるように記録パルス信号の位相および /または振幅を制御することにより 記録条件の設定が行 Oとなる。また、試し書き用記録マークのマーク長が正 50 われるので、従来の技術に比べて記録条件の最適化を簡

略化することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の一実施例による光学的記録再生装置 を示す略線図である。

【図2】この発明の一実施例による光学的記録再生装置 における記録方法を説明するための略線図である。

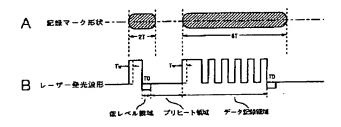
【図3】この発明の一実施例による光学的記録再生装置 における再生方法を説明するためのタイミングチャート である。

【図4】この発明の一実施例による光学的記録再生装置 10 における試し書き処理を説明するためのタイミングチャートである。

【符号の説明】

1 レーザー

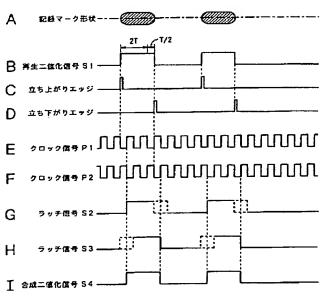
【図2】



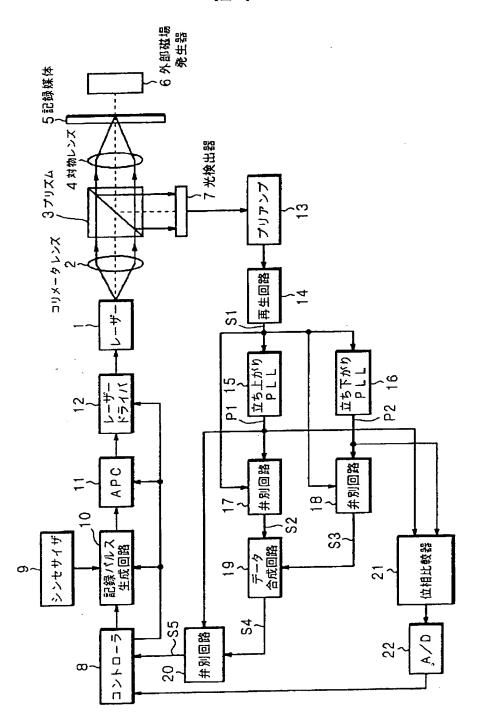
- 5 記録媒体
- 6 外部磁場発生器
- 7 光検出器
- 8 コントローラ
- 10 記録パルス生成回路
- 14 再生回路
- 15 立ち上がりPLL回路
- 16 立ち下がりPLL回路
- 21 位相比較器.
- S 1 再生二値化信号
 - S2、S3 ラッチ信号
 - S 4 合成二值化信号
 - S5 再生信号
 - P1、P2 クロック信号

【図3】

10



【図1】



[図4]

